

терями его кинетической энергии. Расчетные и экспериментальные результаты исследования изменения глубины внедрения ударяющего тела с уменьшением плотности преграды из пористого материала согласуются с зависимостью величины давления p_1 в точке торможения, рассчитанной по ударным адиабатам пористой меди (рис. 1, б).

Основной результат теоретического и экспериментального исследования сверхзвукового внедрения ударяющего тела в пористые среды состоит в том, что эффекты, связанные с ударным сжатием пористых тел, в частности увеличение внутренней энергии и связанная с ним диссипация кинетической энергии ударяющего тела, в значительной степени компенсируют снижение уровня инерционного сопротивления, обусловленное меньшей начальной плотностью по сравнению со сплошными телами того же состава.

Список литературы

- [1] Лаврентьев М. А. // УМН. 1957. Т. 12. № 4. С. 41—56.
- [2] Златин Н. А., Кожушко А. А. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 2. С. 330—334.
- [3] Златин Н. А., Кожушко А. А. // ФГВ. 1980. № 5. С. 94—96.
- [4] Сагомян А. Я. Проникание. М., 1974.
- [5] Шаль Р. // Физика быстропротекающих процессов. М.: Мир, 1971. Т. 2. С. 276—349.
- [6] White J., Wahl M., Backofen J. // J. Appl. Phys. 1982. Vol. 52. № 6. P. 4515—4517.
- [7] Зельдович Я. Б., Райзнер Ю. П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1968.
- [8] High-velocity Impact Phenomena / Ed. R. Kinslow. New York: Academic Press, 1970.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН ССР
Ленинград |

Поступило в [Редакцию]
12 июля 1990 г.

06
© 1991 г.

Журнал технической физики, т. 61, в. 6, 1991

СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НЕМАГНИТНЫЙ—МАГНИТНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК Fe_3O_4 В ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДА МЕТАЛЛ—ДИЭЛЕКТРИК

Н. А. Дрокин, С. Г. Овчинников

Потенциальные барьеры, возникающие в области контакта полупроводников с металлами или другими полупроводниками, определяются электронным энергетическим спектром полупроводников, разностью работ выхода электронов с уровня Ферми и поверхностными состояниями контактирующих материалов. При создании контактов с использованием полупроводников, обладающих атомным магнитным порядком (магнитные полупроводники), можно ожидать существенных изменений барьера структур из-за наличия взаимосвязи электронной подсистемы с магнитными состояниями в таких полупроводниках.

Изменение величины барьера и выпрямляющих характеристик было обнаружено при исследовании контакта металл—магнитный полупроводник HgCr_2Se_4 и CdCr_2Se_4 в рабочих [1, 2] из-за наличия спинового расщепления зон при переходе из парамагнитного в ферромагнитное состояние. Изменения барьера структур должны возникать и при других типах фазовых переходов, существующих в магнитоупорядоченных соединениях, например при переходе металл—полупроводник. Такие переходы, вызванные перестройкой энергетического спектра, наблюдаются в целом ряде соединений d - и f -металлов.

В данной работе для обнаружения изменений в контактной структуре при переходе металл—полупроводник использовался типичный представитель такого перехода — магнетит Fe_3O_4 . Контакт магнетита осуществлялся с широко распространенными полупроводниками Ge , Si , GaAs как p - , так и n -типов с концентрацией примесей $\sim 10^{16} \text{ см}^{-3}$ и удельным сопротивлением $\rho \sim 1—10 \text{ Ом}\cdot\text{см}$. Монокристаллы магнетита в металлической фазе обладали сопротивлением $\rho \sim 20 \text{ Ом}\cdot\text{см}$, а при переходе в полупроводниковую фазу при $T_B = -119 \text{ К}$ оно увеличивалось до значений $\rho \sim 10^4—10^5 \text{ Ом}\cdot\text{см}$.

Контакт осуществлялся при механическом сжатии сколов монокристаллов полупроводников и магнетита. Омический контакт со стороны магнетита изготавливался точечной микрорезкой.

сваркой медного провода, а со стороны полупроводников — термодиффузией соответствующих низкотемпературных сплавов для *p*- и *n*-типов материалов. Исследовались вольт-амперные характеристики (ВАХ) полученных структур в диапазоне температур от 300 до 77 К.

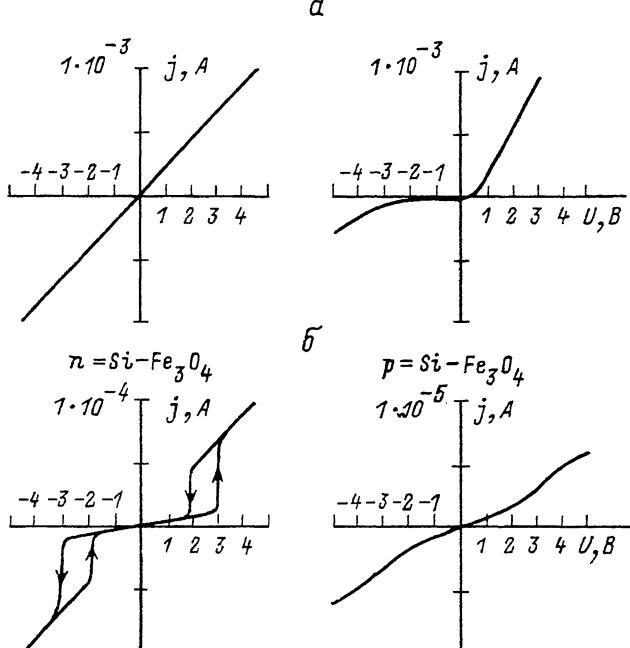


Рис. 1. ВАХ контактов *n*-Si-Fe₃O₄ и *p*-Si-Fe₃O₄ при $T=250$ (а) и 90 К (б).

На рис. 1 приведены ВАХ для контактов *n*-Si-Fe₃O₄ и *p*-Si-Fe₃O₄ при $T=250$ К (магнетит находится в металлической фазе) и при $T=110$ К (в полупроводниковой). При $T > T_B$ для *n*-Si-Fe₃O₄ ВАХ линейны, а для *p*-Si-Fe₃O₄ являются выпрямляющими. В области перехода в полупроводниковое состояние контакт *p*-Si-Fe₃O₄ становится невыпрямляющим,

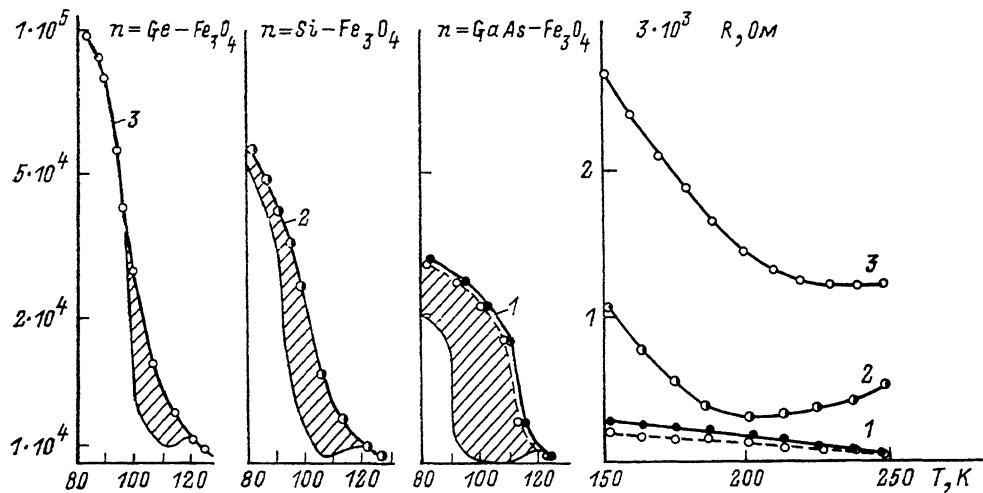


Рис. 2. Температурные зависимости *R* (*T*) контактов Fe₃O₄ с GaAs (1), Si (2), Ge (3).

а для *n*-Si-Fe₃O₄ наблюдается хорошо известный эффект переключения магнетита в высоко-проводящее состояние при достижении критического поля $U_k=3$ В [3]. При дальнейшем понижении температуры критические поля увеличиваются до $U_k=40$ В при 77 К.

Подобные закономерности наблюдаются и для контактов магнетита с Ge и GaAs, однако зависимости *j* (*U*) существенно различны. Для сравнения на прямолинейных участках ВАХ, а при наличии выпрямления в прямом направлении в области малых напряжений ~ 1 В

рассчитывались температурные зависимости электросопротивления R (T) контактных структур, значения которых приведены на рис. 2 для n -типа полупроводников (кривые 1—3), а также для Fe_3O_4 (штриховая кривая), измеренного с металлическими контактами. Заштрихованные участки соответствуют областям переключения при $U > U_k$.

Для структур, содержащих полупроводники p -типа, зависимости R (T) оказываются почти подобными в прямом направлении, но области переключения отсутствуют. В некоторых случаях наблюдалась лишь слабые эффекты переключения вблизи T_B . Видно, что наименьшие отличия зависимостей R (T) от магнетита проявляются для структур с GaAs, а наибольшие — для структур с Ge. Это свидетельствует об образовании барьеров на границе полупроводник—магнетит.

Для интерпретации полученных результатов рассмотрим электронную структуру магнетита. Эволюция представлений об электронных свойствах магнетита характеризуется проникновением зонных аспектов в первоначальную картину перехода порядок—беспорядок в системе ионов Fe^{2+} — Fe^{3+} . Соответствующие расчеты энергии зонных состояний проводились в работе [4], а основанная на этих расчетах теория перехода металл—диэлектрик построена в [5]. Согласно этим работам, поверхность Ферми в металлической фазе образуется тремя зонами d -электронов, принадлежащих ионам Fe в B -узлах. Одна зона является электронной, вторая — дырочной, а третья имеет сложную поверхность Ферми и рассматривается как резервуар электронов, не принимающих непосредственного участия в процессах электроперехода. Число электронов в первой зоне $n_{s1}=0.03$ на формульную единицу, а число дырок в зоне n_{h2} значительно меньше. При понижении $T < T_B = 119$ К за счет эффектов электронодырочного спаривания в спектре электронов появляется щель Δ

$$E^\pm = \pm \sqrt{\xi^2(p) + \Delta^2} - \mu,$$

$\xi^2(p)$ — энергия зонных состояний; μ — химпотенциал; величина Δ зависит от температуры, концентрации электронов и находится самосогласованно.

С использованием этих представлений упрощенная зонная схема гетероструктур представлена на рис. 3, где явно показаны d -подзоны при $T > T_B$ и $T < T_B$ в контакте с p -типа полупроводником. Валентная зона и зона проводимости магнетита разделены щелью $E_g \sim 6$ эВ и на рисунке не показаны.

Видно, что в случае структуры полупроводников p -типа с Fe_3O_4 возникает $p-n$ -гетеропереход при $T > T_B$, который может обладать свойствами выпрямления. Ниже T_B из-за расщепления зоны гетеропереход становится $p-p$ -типа с нелинейной, но не выпрямляющей BAX (рис. 1). При контакте магнетита с полупроводниками n -типа картина становится обратной и при $T < T_B$ возникает $n-p$ -гетеропереход, способствующий эффектам переключения, как и при использовании металлических электродов к магнетиту.

Возникающие в области контакта изгибы зон связаны не только со свойствами электронной структуры полупроводников и магнетита, но и с поверхностными состояниями и для их определения требуются дополнительные исследования.

Список литературы

- [1] Осипов В. В., Михайлов В. И., Самохвалов А. А., Чеботаев Н. М. // ФТТ. 1989. Т. 31. Вып. 9. С. 37—40.
- [2] Меркулов А. И., Радауцан С. И., Тэзлеван В. Е. // ФТП. 1980. Т. 14. Вып. 5. С. 1009—1010.
- [3] Burch T., Craig P. P., Hedrick C. et al. // Phys. Rev. Lett. 1969. Vol. 23. N 25. P. 1444—1449.
- [4] Yanase A., Siratori K. // J. Phys. Soc. Jap. 1984. Vol. 53. N 1. Т. 312—317.
- [5] Овечников С. Г. // ФТТ. 1987. Т. 29. Вып. 6. С. 1758—1762.

Институт физики им. Л. В. Киренского
СО АН СССР
Красноярск

Поступило в Редакцию
12 июля 1990 г.

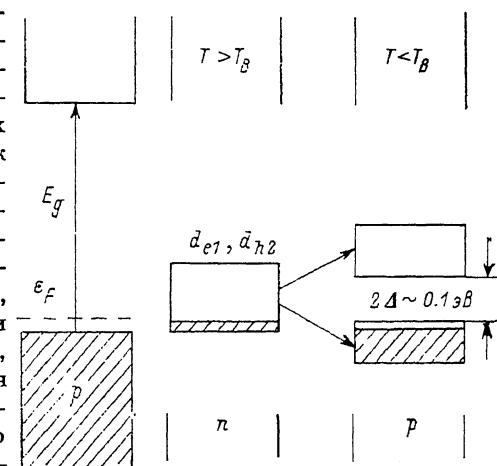


Рис. 3. Энергетическая схема p -типа полупроводника с Fe_3O_4 при $T > T_B$ и $T < T_B$.